

• Sources ponctuelles et étendues • Sources X •

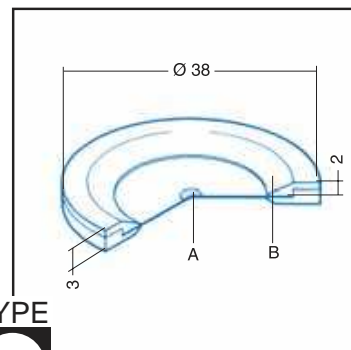
Les sources X servent à l'étalonnage de tous les détecteurs X (compteurs proportionnels, semi-conducteurs, etc.).

• Technique

Ces sources sont caractérisées en flux de photons X_k dans 4π sr, exprimé en s^{-1} .
Les sources ponctuelles (\varnothing 4 mm) sont scellées à chaud entre deux feuilles de plastique mince de $75\ \mu m$ d'épaisseur chacune (masse surfacique totale $12\ mg.cm^{-2}$).
Elles sont montées sur un anneau plastique qui assure la rigidité et permet une manipulation aisée.



Couleur non contractuelle



TYPE



A : surface active diamètre 4 mm
B : anneau plastique épaisseur 3 mm

Sources X

Radionucléide et Période	Énergies des rayonnements (MeV) X_k	Référence	Flux X $s^{-1} (*)$	Activité approximative kBq (*)	Support Diamètre (mm)	Type	Incertitude de mesure %
$^{109}Cd + ^{109}Ag^m$ $4,63 \times 10^2$ jours	0,022	CD109EXSB10	16×10^3	13,5	38	B	3,5
^{55}Fe $9,79 \times 10^2$ jours	0,006	FE55EXSB10	16×10^3	65	38	B	3
^{85}Sr $6,49 \times 10^1$ jours	0,013	SR85EXSB10	16×10^3	30	38	B	4
^{65}Zn $2,44 \times 10^2$ jours	0,008	ZN65EXSB10	16×10^3	40	38	B	5,5

(*) Tolérance de fabrication $\pm 30\%$

• Hors standard

Flux d'émission sur demande

radionucléide type de support
FE55EXSB200KBQ
 type de source (Étalon X) Activité demandée (kBq)

Pour commander : Informations commerciales pages 1.1 à 1.6 du chapitre INFORMATIONS